

## Peter Garry SARSON 氏 群馬大学から博士号を授与

SARSON 氏（欧州の半導体メーカー勤務）とは、LSI テスト関係の国際会議で知り合う。私の発表を聞き、その技術に関心をもち 実際の半導体試験装置で検証したところ有効であったとの連絡を受ける。交流が始まり、一緒に国際学会・論文を発表する。また一緒に関連する国際学会の運営活動も行う。

<https://kobaweb.ei.st.gunma-u.ac.jp/news/pdf/2016/20160722am9IMSTW.pdf>

<https://kobaweb.ei.st.gunma-u.ac.jp/news/pdf/2017/VTSReport20170427am8.pdf>

[http://tttc-vts.org/public\\_html/new/2019/](http://tttc-vts.org/public_html/new/2019/)

同氏は日本の大学に「論文博士」の制度があることを知り、私のところで博士号を取りたいということになり、6件の Journal Paper と博士論文を書き 2018年11月30日(金) に群馬大学から博士号を授与された。

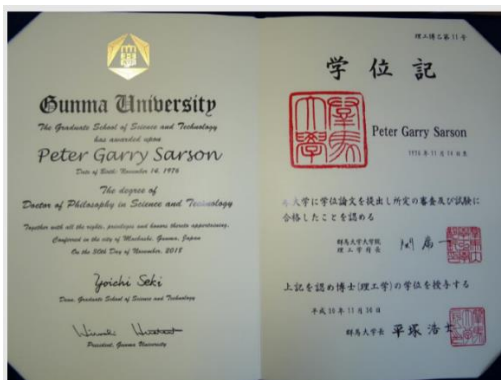
博士論文タイトル: Analogue Mixed Signal Test Development

- Continuous Improvement Exercise in Quality, Reliability, and Reduction in Test Cost of Semiconductor Devices

[https://kobaweb.ei.st.gunma-u.ac.jp/news/pdf/2018/Dissertation\\_Peter\\_Sarson\\_rev11.7.pdf](https://kobaweb.ei.st.gunma-u.ac.jp/news/pdf/2018/Dissertation_Peter_Sarson_rev11.7.pdf)

論文審査委員会：

主査	高田和正	教授
副査	本島邦行	教授
副査	青木 均	客員教授
副査	浅見幸司	客員教授
副査	小林春夫	教授



2018年9月10日 博士公聴会の終了後(Sarson氏は右から2番目)

\*\*\*\* Peter SARSON 氏から \*\*\*\*

It was July 2016 in Spain where we published and presented a small paper on distortion shaping based on some work I had done **from seeing you present at ITC in Seattle**. For some reason you offered to help me do my PH.D. For the next year you helped me to write papers based on my research and showed me the correct way to present my data in a written form. In parallel you helped me form some kind of document out of all disconnected papers to form some form of coherent document that became the initial form of my dissertation. Again, I have no idea how, you convinced 5 professors to judge my work and allow me to come to Japan to present my work. I came and politely I was informed I needed to do some more work, you showed me how to perform simulations correctly and how to document them with block and flow diagrams. I carried out some work I always had wanted to do that I knew would work in principle but I had never had the chance to do. Using simulation. I showed that ATE equipment could possibly be improved and showed how its lifetime could be extended.

Having presented more papers on this, produced more journals and updated my dissertation to reflect all of this I finally came to Japan again in 2018. I'm now a doctor and I have you to solely thank for your encouragement and stoicism in getting me through this process.

Regards

Peter Sarson PH.D SMIEEE

\*\*\*\*\*

下記発表がきっかけである。

Fumitaka Abe, Yutaro Kobayashi, Kenji Sawada, Keisuke Kato, Osamu Kobayashi, [Haruo Kobayashi](#),

“[Low-Distortion Signal Generation for ADC Testing](#),”IEEE International Test Conference, Seattle, WA (Oct. 2014).

これは半導体理工学センター(STARC)との共同研究内容であり、このオリジナルのアイデアは(当時)同社の小林修氏によるものである。それを発展させていくつものアルゴリズムや実験室レベルでの検証を行ってきている(数年前に同社との共同研究が終了したが、現在も研究室で継続している)。アルゴリズム的な内容であり、特許出願は行っていない。フランスのTIMA研究所や米国アイオワ州立大学等で同じ分野の研究をしているグループからは関心をもってもらっている(学会で議論し、論文にも引用されている)。Sarson氏からの「実際の半導体試験装置の環境下で実用化検証できた」という連絡は工学系の研究室の立場からはうれしい限りである。

なお、Sarson氏とは学会発表の公開情報をもとにした研究者レベルの交流であり共同研究のコンタミはない。

写真提供 群馬大学 石川信宣 文責 小林春夫